

20191016評基第004号  
2020年6月10日



# 認 定 証

独立行政法人製品評価技術基盤機構認定センターは、以下の適合性評価機関を JCSS の校正事業者として認定する。

認 定 識 別：JCSS 0198 Calibration

適合性評価機関の名称：株式会社東精エンジニアリング

法人の名称：株式会社東精エンジニアリング

適合性評価機関の所在地：茨城県土浦市北神立町2-14

認 定 範 囲：長さ（詳細は別紙のとおり）

認定要求事項：ISO/IEC 17025:2017

認定スキーム文書(JCSS 認定) (第2版)

6項に定める認定要求事項

認定発効日：2020年6月10日

認定の有効期限：2024年6月9日

(初回認定発効日：2007年9月3日)

独立行政法人製品評価技術基盤機構

認定センター所長 岸本 勇夫

IAJapan (独立行政法人製品評価技術基盤機構認定センター) は、ILAC(国際試験所認定協力機構) 及び APAC (アジア太平洋認定協力機構) の MRA (相互承認取決め) に署名している認定機関です。

相互承認取決めに係る要求事項は、認定の基準 (該当する国際規格) 適合義務の他に、技能試験参加要件及び定期的な審査の受審並びに MRA 対応事業者に対するトレーサビリティ要求事項 (方針) を指します。

この事業者は ISO/IEC 17025:2017 試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項に適合しています。この認定は当該事業者が認定された範囲において一貫して技術的に有効な試験結果及び校正を提供するために必要な技術能力要求事項及びマネジメントシステム要求事項を満たしていることを証明するものです (2017年4月 ISO-ILAC-IAF 共同コミュニケ参照)。

本認定証は、発行日時点の認定情報であり、最新の認定情報は IAJapan のホームページで確認することができます。



登録（認定）に係る区分：長さ

法律に基づく初回登録年月日：2007年9月3日

国際MRA対応初回認定発効日：2007年9月3日

校正手法の区分の呼称[登録更新（再認定）年月日]：形状測定器[2020年6月10日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：現地校正

校正測定能力

校正手法の区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
形状測定器	座標測定機	1000 mm 以下	$(0.24 + 0.33 \times L/1000) \mu\text{m}$ [ $L$ = 測定長さ (mm) ]
	表面性状 (粗さ測定)	算術平均粗さ 0.2 $\mu\text{m}$ 以上 5 $\mu\text{m}$ 以下	$\sqrt{(3.0 \times Ra)^2 + (21)^2} \text{ nm}$ $Ra$ = 算術平均粗さ ( $\mu\text{m}$ )
		最大高さ粗さ 1 $\mu\text{m}$ 以上 22 $\mu\text{m}$ 以下	$\sqrt{(3.0 \times Rz)^2 + (260)^2} \text{ nm}$ $Rz$ = 最大高さ粗さ ( $\mu\text{m}$ )

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

(English Translation)



## Certificate of Accreditation

IAJapan hereby accredits the following conformity assessment body as a calibration laboratory of Japan Calibration Service System (JCSS).

Accreditation Identification: JCSS 0198 Calibration

Name of Conformity Assessment Body:

Tosei Engineering Corp.

Name of Legal Entity:

Tosei Engineering Corp.

Location of Conformity Assessment Body:

2-14, Kita-kandatsumachi, Tsuchiura-city, Ibaraki 300-0015, Japan

Scope of Accreditation:

Length (as attached)

Accreditation Requirement:

ISO/IEC 17025: 2017

Accreditation Requirements in the Section 6 of Accreditation Scheme (JCSS) 2nd Edition

Effective Date of Accreditation: 2020-06-10

Expiry Date of Accreditation: 2024-06-09

(Date of Initial Accreditation: 2007-09-03)

KISHIMOTO Isao

Chief Executive, IAJapan

National Institute of Technology and Evaluation

- 
- International Accreditation Japan (IAJapan) is a laboratory accreditation body which has signed MRAs of ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) and APAC (Asia Pacific Accreditation Cooperation).
  - MRA requirements are, in addition to relevant international standards and guides, requirements for participation in proficiency testing programs, surveillance and reassessment, and the policy for the traceability of measurement for MRA purpose.
  - This laboratory fulfills ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. This accreditation means this laboratory meets both the technical competence requirements and management system requirements that are necessary for it to consistently deliver technically valid test results and calibrations (refer to joint ISO-ILAC-IAF Communiqué dated April 2017).
  - This accreditation information is the information as of the effective date of accreditation. The latest accreditation information can be found on the IAJapan website.



General Field of Calibration: Length

Date of Initial Accreditation of the Field: 2007-09-03

Permanent Laboratory/On-site Calibration: On-site Calibration

Calibration and Measurement Capabilities

Calibration Procedures# and Type of Instruments/Materials to be calibrated		Range	Expanded Uncertainty (Level of Confidence Approximately 95 %)
Dimensional Measuring Instrument	Coordinate Measuring Machines	Up to 1000 mm	$(0.24 + 0.33 \times L/1000) \mu\text{m}$ <i>L</i> is measured length (mm)
	Surface Texture	Arithmetical mean deviation of the roughness profile From 0.2 $\mu\text{m}$ up to 5 $\mu\text{m}$	$\sqrt{(3.0 \times Ra)^2 + (21)^2}$ nm <i>Ra</i> ; Arithmetical mean deviation of the roughness profile ( $\mu\text{m}$ )
		Maximum height of the roughness profile From 1 $\mu\text{m}$ up to 22 $\mu\text{m}$	$\sqrt{(3.0 \times Rz)^2 + (260)^2}$ nm <i>Rz</i> ; Maximum height of the roughness profile ( $\mu\text{m}$ )

#All Calibration Procedures are in-house procedures developed by this laboratory.